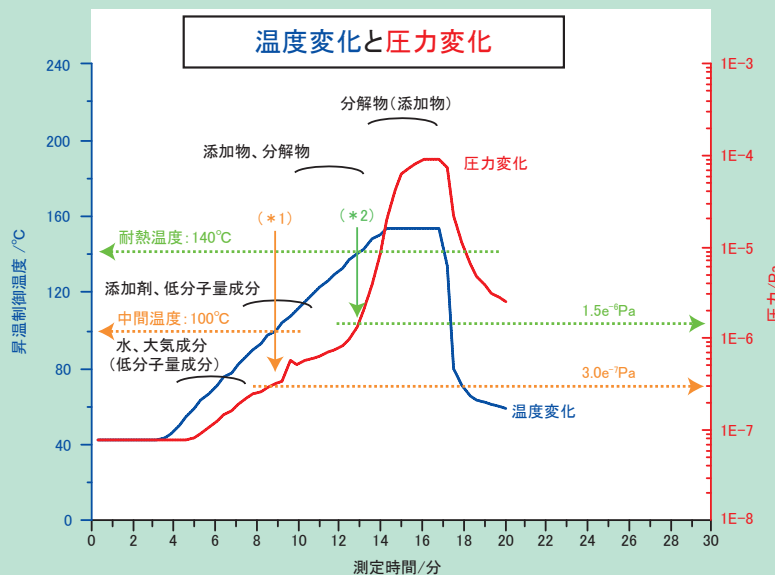


高真空下における高分子フィルムからの昇温脱離分析 — TDS-MS —

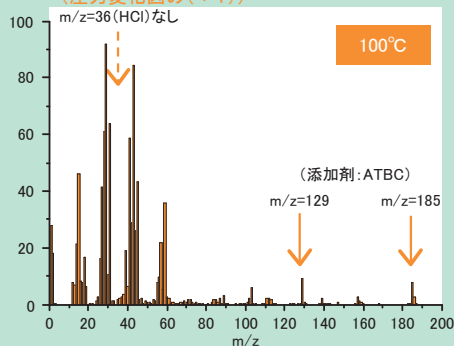
概要

TDS-MSは高真空下で昇温させながら、脱離成分を質量分析計で高感度で検出することができる。昇温しながらの測定なので、各温度での脱離成分を比較することができる。高真空下で熱がかかる状態での使用が想定される高機能樹脂製品の評価に最適である。分析対象は、半導体ならびにディスプレイの製造プロセスで使用する樹脂素材やその製造装置の樹脂製構成部材等があげられる。

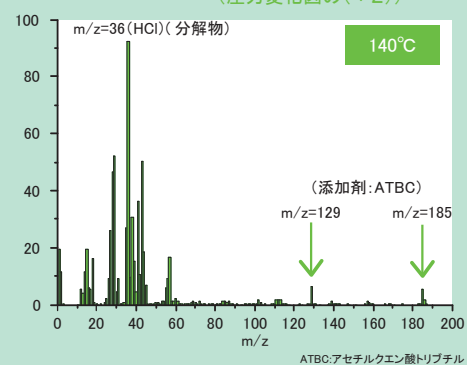
● 分析例 ポリ塩化ビニリデンフィルムのTDS-MS測定



中間温度(100°C)到達時の質量スペクトル
(圧力変化図の(*1))



耐熱温度(140°C)到達時の質量スペクトル
(圧力変化図の(*2))



昇温しながら温度毎の脱離成分の比較ができる

株式会社 三井化学分析センター

<http://www.mcanac.co.jp>

お問合せ ☎03-5524-3851